



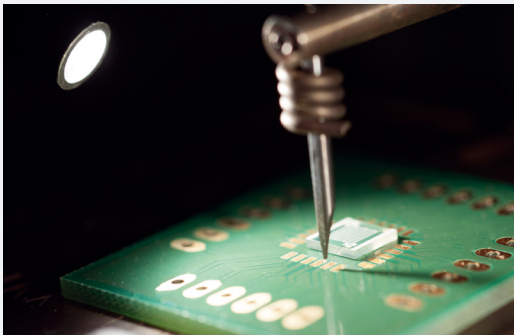
Ausstattung am Standort Zweibrücken Analytik

Neue Technologien

- Feststoffdrucker (Fujifilm, Dimatix)
- Klimaschrank (Nema Industries, NCC 4009)
- Mobile Reinraumzelle
- Heißpräge (Jenoptik, HEX 01)

Aufbau- und Verbindungstechnik

- Wedge-Wedge-Bonder (Westbond, 7602C-79C)
- Ball-Wedge-Bonder
- Pull-Tester (dage, Microtester 22A)
- Pick and Place-System (Dr. Tresky, 3002)
- SMD Arbeitsplatz, Reflow-Ofen (Elector, QS-5188 C)
- Nd: YAG-Laser (Haas, Vektormark)



Chemische Analytik

- HPLC mit RID und DAD (Agilent, 1100 Series)
- AAS (Perkin-Elmer, 1100B)
- UV-VIS (Perkin-Elmer, Lambda40)
- Voltammetrie (Metrohm)

Zelluläre Elektrophysiologie

- Patch-Clamp Messplatz mit Fluoreszenzmikroskop und Substanz-Applikation
- MEA-System mit Heizung und Stimulation für Standard- und „perforated“-Chips (MSC)
- Zell-Injektionssystem (Eppendorf, FemtoJet)



REM-Labor

- Rasterelektronenmikroskop (Zeiss, Supra 40) mit EDX (BrukerAXS, Quantax)
- Rasterelektronenmikroskop (Leo, 435vp) mit EDX (Röntec, SiLi)
- Schleif-/Poliermaschine (Struers, Rotopol 21, Rotoforce 4)
- Ionenätzanlage (Leica, TIC3X)
- Proben-Coater für Rasterelektronenmikroskop (Cressington, 108auto (Au) Leica ACE 600 (Cr/C))



Kontakt:

Hochschule Kaiserslautern
Amerikastraße 1
67659 Kaiserslautern

Prof. Dr. Monika Saumer
monika.saumer@hs-kl.de
T +49 631 3724-5420

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Lilischkis
rainer.lilischkis@hs-kl.de
T +49 631 3724-5456

Metrologie

- Mechanisches Profilometer (Veeco, Dektak „XT“)
- Optisches Profilometer (UBM)
- Rastersondenmikroskope AFM (Digital Instruments, Dimension 3100, Dimension Icon)
- Raman Workstation (LabRAM NanoEvo mit AIST AFM Combiscope)
- Röntgenreflektometer XRR (Bruker AXS, D8)
- Spektroskopisches Ellipsometer (Sentech, SE850 (UV/VIS))
- Kontaktwinkelmessgerät (DataPhysics Instruments, OCA 15)
- Fluoreszenzspektrometer (Jasco, FP-8300)
- Mikroskope (z.B. Olympus, BX51)

Elektrische und magnetische Charakterisierung

- LCR Meter (Agilent, 4284A)
- Multimeter DMM (HP, 34401A)
- Parameteranalyzer (Agilent, 4156C und Keithley, 4200)
- Vibrationsmagnetometer (Eigenbau)

Impedanz Messplatz

- FET Mini-Verstärker (Eigenbau, 16-Kanal)
- FET Verstärker (Eigenbau, 16-Kanal)
- MEA Verstärker (Eigenbau, 64-Kanal)
- Impedanzmessplätze (Zahner Zennium E, Ivium Compactstat)
- Lock-In Verstärker (Stanford Research, SR 830 und Zürich Instruments, HF2LI)

<https://www.hs-kl.de/ims>